

**„ Modellierung und Testverfahren
für CMOS-kompatible Fluxgatesensoren mit
planaren weichmagnetischen Kernen “**

Vom Fachbereich für Elektrotechnik der
Gerhard-Mercator-Universität-Gesamthochschule-Duisburg
zur Erlangung des akademischen Grades eines
Doktors der Ingenieurwissenschaften
genehmigte Dissertation

von

Dipl. Ing. Ulrich Wende

aus

Bautzen

Referent:
Korreferent:
Tag der mündlichen Prüfung:

Prof. Dr. rer. nat. G. Zimmer
Prof. Dr.-Ing. E. Kubalek
22. November 1999